

素子形式	D1UOR2-45	器具番号		製造番号	
------	-----------	------	--	------	--

1. 動作値 (動作時間整定) 51L: 最小、51H: 最小、51LT: N(定限時DT)

要素\整定		1 A	6 A	12 A	判定基準 公称値(整定値)の ±5%以内
51L	A相	A	A	A	
	C相	A	A	A	
許容誤差範囲		0.95~1.05A	5.70~6.30A	11.4~12.6A	
要素\整定		2 A	40 A	80 A	
51H	A相	A	A	A	
	C相	A	A	A	
許容誤差範囲		1.90~2.10A	38.0~42.0A	76.0~84.0A	

2. 動作時間 (整定) 51L: 最小、51H: 最小、51LT: N(定限時DTの最小整定は3回測定)

要素\整定		INST	10s	20s	判定基準 公称値(整定値)の ±5%以内 最小整定時は50ms以下 (※)許容誤差の下限値 : ±50ms
51L	A相 200%	~ ms	s	s	
	C相 200%	~ ms	s	s	
許容誤差範囲		50ms以下	9.5~10.5s	19.0~21.0s	
要素\整定		INST	1.50s	3.00s	
51H	A相 200%	~ ms	s	s	
	C相 200%	~ ms	s	s	
許容誤差範囲		50ms以下	1.43~1.57s	2.85~3.15s	

(整定) 51L: 最小、51H: 最小、51LT: N(UI1)

要素\整定		1	4	7	10	(備考)
51LT A相	300%	s	s	s	s	注1) 下記公称動作 時間に対して左記表の 判定基準: □%以内  (※)動作時間誤差の 下限値: ±50ms
	判定基準	±12%	±12%	±12%	±12%	
	許容誤差範囲	0.508~0.646s	2.04~2.58s	3.56~4.52s	5.08~6.46s	
	500%	—	—	—	s	注2) NIL、EIL、LIL、UIL 試験時は51Hが動作 しない整定にて測定 して下さい。
	判定基準	—	—	—	±7%	
	許容誤差範囲	—	—	—	2.98~3.42s	
	1000%	—	—	—	s	
判定基準	—	—	—	±5%		
許容誤差範囲	—	—	—	1.54~1.70s		
要素\整定		1	4	7	10	(備考)
51LT C相	300%	s	s	s	s	注1) 下記公称動作 時間に対して左記表の 判定基準: □%以内  (※)動作時間誤差の 下限値: ±50ms
	判定基準	±12%	±12%	±12%	±12%	
	許容誤差範囲	0.508~0.646s	2.04~2.58s	3.56~4.52s	5.08~6.46s	
	500%	—	—	—	s	注2) NIL、EIL、LIL、UIL 試験時は51Hが動作 しない整定にて測定 して下さい。
	判定基準	—	—	—	±7%	
	許容誤差範囲	—	—	—	2.98~3.42s	
	1000%	—	—	—	s	
判定基準	—	—	—	±5%		
許容誤差範囲	—	—	—	1.54~1.70s		

素子形式	D1UOR2-45	器具番号		製造番号	
------	-----------	------	--	------	--

51LT 反限時判定式

①反限時特性1 (NI1)  $T = \left( \frac{3}{I-1} + 1.7 \right) \frac{n}{10}$

②超反限時特性1 (EI)  $T = \left( \frac{80}{I^2-1} \right) \frac{n}{10}$

③長反限時特性 (LI)  $T = \left( \frac{150}{I-1} + 3 \right) \frac{n}{10}$

④反限時特性2 (UI1)  $T = \left( \frac{12.7}{I-0.7} + 0.25 \right) \frac{n}{10}$

⑤反限時特性3 (NI2)  $T = \left( \frac{7.8}{I-1} + 0.9 \right) \frac{n}{10}$

⑥反限時特性4 (NI3)  $T = \left( \frac{4}{I-1} + 1 \right) \frac{n}{10}$

⑦反限時特性5 (UI2)

0 ≤ I < 1.8の時  $T = \left( \frac{9.83}{I-0.7} + 3 \right) \frac{n}{10}$

1.8 ≤ I < 4の時  $T = \left( \frac{11.6}{I-0.75} + 0.7 \right) \frac{n}{10}$

4 ≤ I < 8の時  $T = \left( \frac{6.9}{I-0.79} + 2.1 \right) \frac{n}{10}$

8 ≤ Iの時  $T = \left( \frac{7.3}{I-0.75} + 2.1 \right) \frac{n}{10}$

⑧超反限時特性2 (F1)

0 ≤ I < 3の時  $T = \left( \frac{19.1}{I-1} - 3.4 \right) \frac{n}{10}$

3 ≤ I < 8の時  $T = \left( \frac{8.16}{I-1.746} - 0.30 \right) \frac{n}{10}$

8 ≤ Iの時  $T = \left( \frac{3.639}{I-3.777} + 0.135 \right) \frac{n}{10}$

T : nの公称動作時間

n : 動作時間整定

基準動作時間整定 (T=10) 公称動作時間

I : (入力値) / (動作値整定)

入力/特性	NI1	EI	LI	UI1	NI2	NI3	UI2	F1
150%の場合	--	--	--	--	--	--	15.3s	--
300%の場合	3.20s	10.0s	78.0s	5.77s	4.80s	3.00s	5.86s	6.20s
500%の場合	2.45s	3.33s	40.5s	3.20s	2.85s	2.00s	3.74s	2.20s
1000%の場合	2.03s	0.81s	19.7s	1.62s	1.77s	1.44s	2.89s	0.72s

[共通項目]

1. 負担

判定基準: 公称値の110%以内

回路	定格	公称値	測定値	測定値	判定
CT2次回路	A相	5 A	0.3 VA	mV	VA
	C相	5 A	0.3 VA	mV	VA
制御電源	110 V	5 W	mA	W	

2. 電源開閉試験 制御電源入切、低下、上昇にて不動作を確認する。

3. 強制動作試験 強制動作にて表示、接点出力を確認する。

4. ランプテスト ランプテストにてパネル表示を確認する。

5. 自動監視試験 常時監視異常検出動作、点検動作にて異常の無い事を確認する。

判定	
判定	
判定	
判定	